



SunVTS™ 5.1 Patch Set 1 テスト リファレンスマニュアル (補足)

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054 U.S.A.

Part No. 817-0325-10
2002 年 12 月, Revision A

コメントの宛先: docfeedback@sun.com

米国 Sun Microsystems, Inc. (以下、米国 Sun Microsystems 社とします)は、本書に記述されている製品に採用されている技術に関する知的所有権を有しています。これら知的所有権には、<http://www.sun.com/patents>に掲載されているひとつまたは複数の米国特許、および米国ならびにその他の国におけるひとつまたは複数の特許または出願中の特許が含まれています。

本書およびそれに付属する製品は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社による事前の許可なく、本製品および本書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。

本製品のフォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権法により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。

本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

本製品は、株式会社モリサワからライセンス供与されたリュウミン L-KL (Ryumin-Light) および中ゴシック BBB (GothicBBB-Medium) のフォント・データを含んでいます。

本製品に含まれる HG 明朝 L と HG ゴシック B は、株式会社リコーがリコービマジクス株式会社からライセンス供与されたタイプフェースマスタをもとに作成されたものです。平成明朝体 W3 は、株式会社リコーが財団法人 日本規格協会 文字フォント開発・普及センターからライセンス供与されたタイプフェースマスタをもとに作成されたものです。また、HG 明朝 L と HG ゴシック B の補助漢字部分は、平成明朝体 W3 の補助漢字を使用しています。なお、フォントとして無断複製することは禁止されています。

Sun, Sun Microsystems, AnswerBook2, docs.sun.com, SunVTS は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems 社の商標もしくは登録商標です。サン の ゴモマーク および Solaris は、米国 Sun Microsystems 社の登録商標です。

すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC 商標が付いた製品は、米国 Sun Microsystems 社が開発したアーキテクチャーに基づくものです。

OPENLOOK、OpenBoot、JLE は、サン・マイクロシステムズ株式会社の登録商標です。

ATOK は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。ATOK8 は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、ATOK8 にかかる著作権その他の権利は、すべて株式会社ジャストシステムに帰属します。ATOK Server/ATOK12 は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、ATOK Server/ATOK12 にかかる著作権その他の権利は、株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

本書で参照されている製品やサービスに関しては、該当する会社または組織に直接お問い合わせください。

OPEN LOOK および Sun Graphical User Interface は、米国 Sun Microsystems 社が自社のユーザーおよびライセンス実施権者向けに開発しました。米国 Sun Microsystems 社は、コンピュータ産業用のビジュアルまたはグラフィカル・ユーザーインターフェースの概念の研究開発における米国 Xerox 社の先駆者としての成果を認めるものです。米国 Sun Microsystems 社は米国 Xerox 社から Xerox Graphical User Interface の非独占的ライセンスを取得しており、このライセンスは米国 Sun Microsystems 社のライセンス実施権者にも適用されます。

Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions set forth in the Sun Microsystems, Inc. license agreements and as provided in DFARS 227.7202-1(a) and 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (Oct. 1998), FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19, or FAR 52.227-14 (ALT III), as applicable.

本書は、「現状のまま」をベースとして提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の黙示の保証を含みそれに限定されない、明示的であるか黙示的であるかを問わない、なんらの保証も行われぬものとします。

本書には、技術的な誤りまたは誤植のある可能性があります。また、本書に記載された情報には、定期的に変更が行われ、かかる変更は本書の最新版に反映されます。さらに、米国サンまたは日本サンは、本書に記載された製品またはプログラムを、予告なく改良または変更することがあります。

本製品が、外国為替および外国貿易管理法 (外為法) に定められる戦略物資等 (貨物または役務) に該当する場合、本製品を輸出または日本国外へ持ち出す際には、サン・マイクロシステムズ株式会社の事前の書面による承諾を得ることのほか、外為法および関連法規に基づく輸出手続き、また場合によっては、米国商務省または米国所轄官庁の許可を得ることが必要です。

原典: SunVTS 5.1 Patch Set 1 Test Reference Manual Supplement
Part No: 816-7702-10
Revision A



Adobe PostScript

目次

1. 概要 1
2. Blade Support Chip テスト (bsctest) 3
 - bsctest のオプション 3
 - bsctest のテストモード 5
 - bsctest のコマンド行構文 5
3. 環境テスト (env6test) 7
 - env6test のオプション 7
 - env6test のテストモード 9
 - env6test のコマンド行構文 9
4. I2C 集積回路間テスト (i2c2test) 11
 - i2c2test のオプション 11
 - i2c2test のテストモード 13
 - i2c2test のコマンド行構文 13
5. 整数ユニットテスト (iutest) 15
 - iutest のオプション 15
 - iutest のテストモード 17
 - iutest のコマンド行構文 17

6. System Service Processor テスト (ssptest)	19
ssptest のサブテスト	19
ssptest のオプション	21
ssptest のテストモード	25
ssptest のコマンド行構文	25

第1章

概要

このマニュアルは、『SunVTS™ 5.1 テストリファレンスマニュアル』を補足するものであり、SunVTS 5.1 Patch Set と同時にリリースされた新しいテストとテストの拡張機能について説明しています。このマニュアルに記載されている新しいテストとテストの拡張機能は、Solaris サプリメント CD に収録されている SunVTS 5.1 Patch Set 1 (PS1) ソフトウェアで提供されています。

SunVTS 5.1 PS1 は、Solaris 8 HW 12/02 オペレーティング環境上での動作を前提に導入および設計されました。しかし SunVTS 5.1 PS1 ソフトウェアは、Solaris 8 2/02、Solaris 9、および Solaris 9 9/02 オペレーティング環境に対応しています。SunVTS 5.1 PS1 ソフトウェアを使用する際には、上記のいずれかのオペレーティング環境で実行することをお勧めします。

SunVTS ソフトウェアと SunVTS 5.1 でリリースされた全テストについての詳細は、『SunVTS 5.1 テストリファレンスマニュアル』を参照してください。すべてのテスト構成モード、インタフェース、およびオプションについては、『SunVTS 5.1 ユーザーマニュアル』を参照してください。

このリリースでは、次の新しいテストが導入されています。

- Blade Support Chip テスト (bsctest)。第 2 章を参照してください。
- 環境テスト (env6test)。第 3 章を参照してください。
- I2C 集積回路間テスト (i2c2test)。第 4 章を参照してください。

このリリースでは、すでにリリースされている以下のテストに拡張が加えられています。

- 整数ユニットテスト (iutest)。第 5 章を参照してください。
- System Service Processor テスト (ssptest)。第 6 章を参照してください。

注 – System Service Processor テスト (ssptest) は、SunVTS 5.1 では Remote System Control テスト (rsctest) というテスト名でした。現在、Remote System Control 1.0 と 2.0 ハードウェアに加え、Advanced Lights-Out Management ハードウェアもサポートするようになったため、テスト名が変更されています。

第2章

Blade Support Chip テスト (bsctest)

bsctest では、Sun Fire™ B100 ブレードシステムで使用されている Blade Support Chip とこのチップをサポートしているハードウェアのテストを行います。テスト対象チップには、Open Boot Prom (OBP) チップと Time of Day (ToD) Prom チップがあります。



注意 – LED サブテストが選択されている場合は、ブレードの LED が変わることに注意してください。テストが完了すると、LED は正しい状態に戻ります。

bsctest のオプション

ダイアログボックスを表示するには、システムマップにあるテスト名を右クリックし、**Test Parameter Options** を選択します。システムマップにこのテスト名が表示されない場合は、グループツリーを展開すると表示される場合があります。展開しても表示されない場合は、このテストに合ったデバイスがシステムに含まれていない可能性があります。詳細は、『SunVTS ユーザーマニュアル』を参照してください。

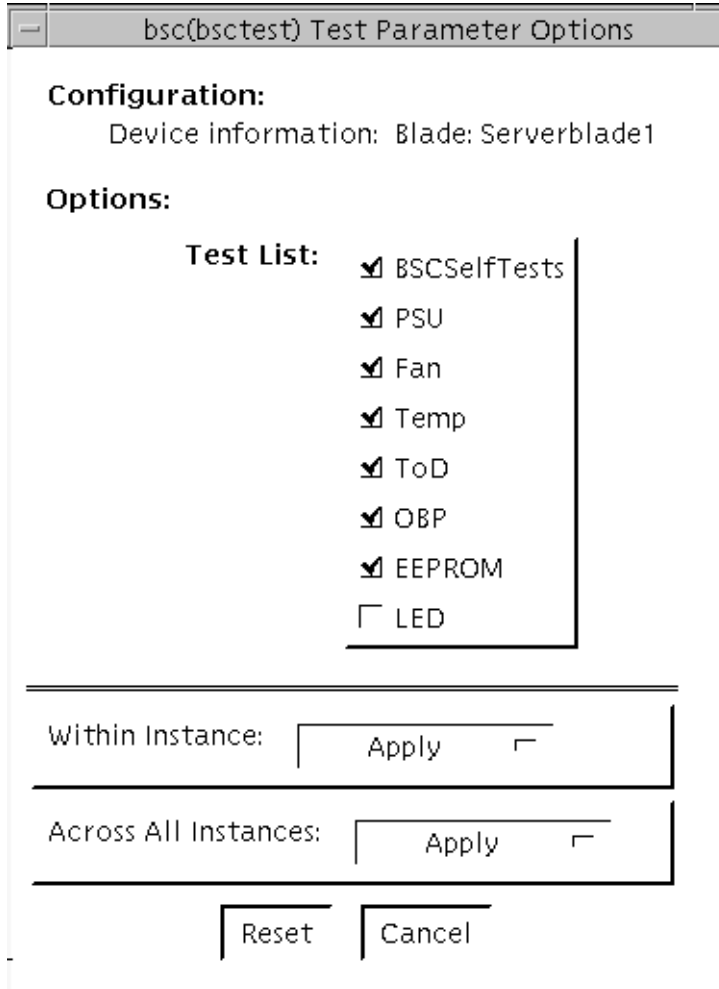


図 2-1 bscctest のテストパラメタオプションダイアログボックス

表 2-1 bscctest のオプション

bscctest のオプション	説明
BSCSelfTests	BSC を呼び出して組み込みセルフテスト (BIST) を実行します。
PSU	電源装置の状態の読み取り専用検査を実行します。
Fan	ファンの状態の読み取り専用検査を実行します。
Temp	温度モニターの状態の読み取り専用検査を実行します。
ToD	Time of Day チップの読み取り専用検査を実行します。

表 2-1 bsctest のオプション (続き)

bsctest のオプション	説明
OBP	プラットフォーム固有の Open Boot プロパティの読み取り専用検査を実行します。
EEPROM	EEPROM の読み取り専用検査を実行します。
LED	保守要求 LED の状態の読み取り専用検査を実行し、3 つの LED すべて (電源、保守要求、取り外し可能) を同時に 4Hz で点滅させてから、元の状態に戻すテストを実行します。

bsctest のテストモード

表 2-2 bsctest がサポートしているテストモード

テストモード	説明
接続テスト	BSC、OBP、および ToD デバイスを開きます。
機能テスト	LED テストがオフになっているデフォルトの状態ですべてのテストを実行します。
オンライン	BSCSelfTests と LED Flashing テストを除く、すべてのテストを実行します。

bsctest のコマンド行構文

`/opt/SUNWvts/bin/bsctest` 標準引数 [-o dev=デバイス名 test=<テストリスト>]

表 2-3 bsctest のコマンド行構文

引数	説明
dev=デバイス名	デバイス名は、テスト対象のデバイスの名前です。たとえば、bsc。
test=テストリスト	テストリストは、実行するサブテストを列挙します。たとえば、BSCSelfTests, PSU, Fan, Temp, ToD, OBP, EEPROM, LED

注 - 64 ビットのテストは、sparcv9 サブディレクトリに格納されています (/opt/SUNWvts/bin/sparcv9/**テスト名**)。このディレクトリにテストが存在しない場合は、そのテストは、32 ビットのテストとしてだけ実行することができます。詳細は、『SunVTS 5.1 テストリファレンスマニュアル』(816-7254-10) の「32 ビットテストと 64 ビットテスト」を参照してください。

第3章

環境テスト (env6test)

env6test は、環境サブシステムを実行して、その妥当性検査を行います。このテストには、システムのファン、キースイッチ、LED、電源装置、および温度センサーを検査するサブテストも含まれています。

このテストはスケラブルテストではありません。

env6test のオプション

ダイアログボックスを表示するには、システムマップにあるテスト名を右クリックし、**Test Parameter Options** を選択します。システムマップにこのテスト名が表示されない場合は、グループツリーを展開すると表示される場合があります。展開しても表示されない場合は、このテストに合ったデバイスがシステムに含まれていない可能性があります。詳細は、『SunVTS ユーザーマニュアル』を参照してください。

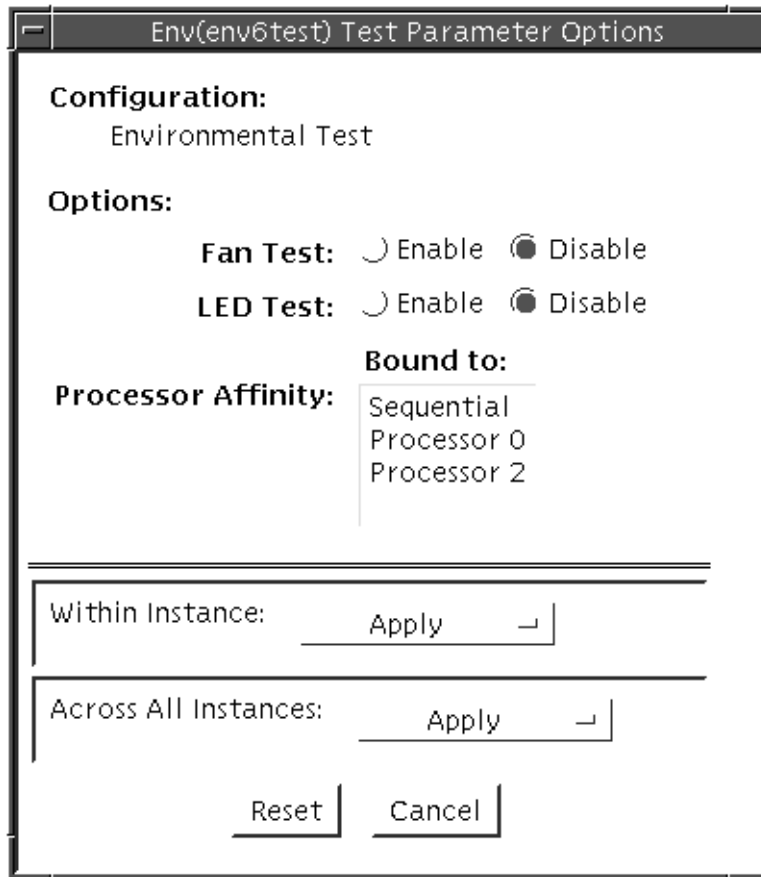


図 3-1 env6test のテストパラメタオプションダイアログボックス

表 3-1 env6test のオプション

env6test のオプション	説明
Fan Test	システムのファンの状態、許容性、および速度を検査します。デフォルトは Disable (無効) です。
LED Test	システムの LED の ON と OFF を切り替えて、LED のすべての状態を検査します。デフォルトは Disable (無効) です。

env6test のテストモード

表 3-2 env6test がサポートしているテストモード

テストモード	説明
接続テスト	デバイスの現在の状態を通知します。
機能テスト	すべてのテストを実行します。ファンと LED のサブテストが有効になっている場合は、これらも実行します。

env6test のコマンド行構文

`/opt/SUNWvts/bin/env6test` 標準引数
`-o dev=raw` デバイス名, `led=Enable|Disable`, `fan=Enable|Disable`

表 3-3 env6test のコマンド行構文

引数	説明
<code>dev=raw</code> デバイス名	テストする raw デバイス名を指定します。 デフォルトは <code>/dev/env</code> です。
<code>led=Enable Disable</code>	LED サブテストを有効または無効にします。デフォルトは <code>Disable</code> (無効) です。
<code>fan=Enable Disable</code>	ファンサブテストを有効または無効にします。デフォルトは <code>Disable</code> (無効) です。

注 - 64 ビットのテストは、`sparcv9` サブディレクトリに格納されています (`/opt/SUNWvts/bin/sparcv9/テスト名`)。このディレクトリにテストが存在しない場合は、そのテストは、32 ビットのテストとしてだけ実行することができます。詳細は、『SunVTS 5.1 テストリファレンスマニュアル』(816-7254-10) の「32 ビットテストと 64 ビットテスト」を参照してください。

第4章

I2C 集積回路間テスト (i2c2test)

i2c2test は、各種 I2C デバイスでの適切な配置、動作、およびデータの完全性を確認するために設計されています。

このテストはスケーラブルテストではありません。

i2c2test のオプション

ダイアログボックスを表示するには、システムマップにあるテスト名を右クリックし、**Test Parameter Options** を選択します。システムマップにこのテスト名が表示されない場合は、グループツリーを展開すると表示される場合があります。展開しても表示されない場合は、このテストに合ったデバイスがシステムに含まれていない可能性があります。詳細は、『SunVTS ユーザーマニュアル』を参照してください。

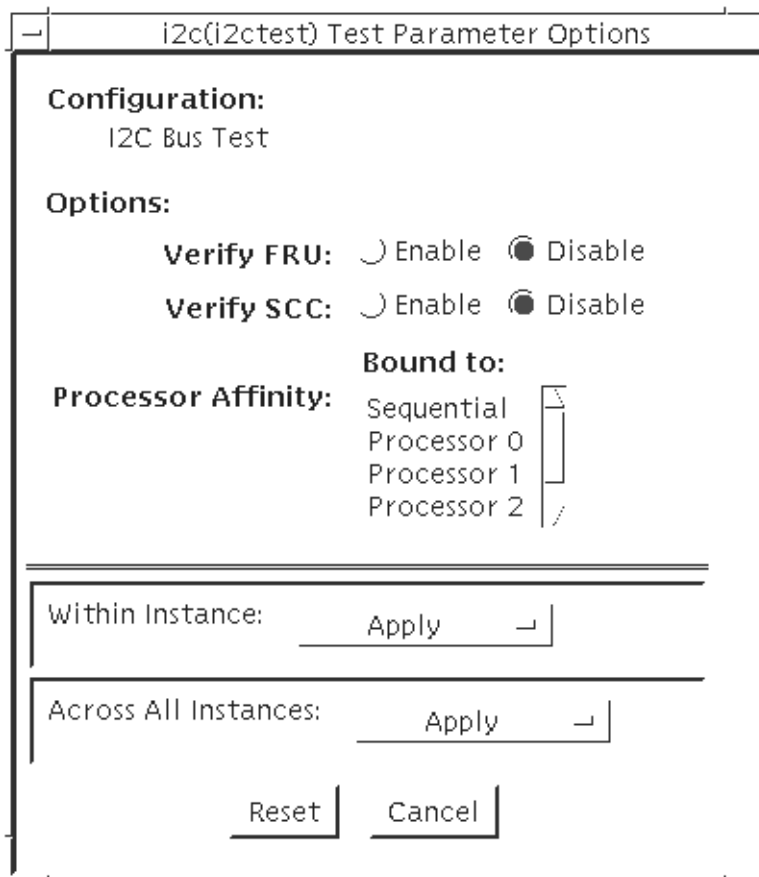


図 4-1 i2c2test のテストパラメタオプションダイアログボックス

表 4-1 i2c2test のオプション

i2c2test のオプション	説明
Verify FRU	FRU の状態を確認します。デフォルトは Disable (無効) です。
Verify SCC	SCC の状態を確認します。デフォルトは Disable (無効) です。
Processor Affinity	テスト対象のプロセッサを順に指定します。

i2c2test のテストモード

表 4-2 i2c2test がサポートしているテストモード

テストモード	説明
接続テスト	すべての I2C デバイスへの接続を確認するテストを実行します。
機能テスト	すべての I2C デバイスへの接続を確認するテストを実行するとともに、fru と scc の内容がユーザーが選択したものと一致していることを確認するテストも実行します。

i2c2test のコマンド行構文

`/opt/SUNWvts/bin/i2c2test` 標準引数
`-o dev=raw` デバイス名, `chkfru=Enable|Disable`, `chkscc=Enable|Disable`

表 4-3 i2c2test のコマンド行構文

引数	説明
<code>dev=raw</code> デバイス名	テストする raw デバイス名を指定します。
<code>chkfru=Enable Disable</code>	FRU の状態を確認します。デフォルトは <code>Disable</code> (無効) です。
<code>chkscc=Enable Disable</code>	SCC の状態を確認します。デフォルトは <code>Disable</code> (無効) です。

注 - 64 ビットのテストは、sparcv9 サブディレクトリに格納されています (`/opt/SUNWvts/bin/sparcv9/テスト名`)。このディレクトリにテストが存在しない場合は、そのテストは、32 ビットのテストとしてだけ実行することができます。詳細は、『SunVTS 5.1 テストリファレンスマニュアル』(816-7254-10) の「32 ビットテストと 64 ビットテスト」を参照してください。

第5章

整数ユニットテスト (iutest)

整数ユニットテスト (iutest) は、Sun SPARC CPU の常駐整数ユニットをテストします。このテストでは、CPU の整数ユニットのレジスタウィンドウをすべて検査します。正常にテストが完了した場合は、レジスタウィンドウがすべて正常に機能していることを意味し、テストに失敗した場合は、レジスタで障害が発生したことを意味します。

iutest のオプション

ダイアログボックスを表示するには、システムマップにあるテスト名を右クリックし、**Test Parameter Options** を選択します。システムマップにこのテスト名が表示されない場合は、グループツリーを展開すると表示される場合があります。展開しても表示されない場合は、このテストに合ったデバイスがシステムに含まれていない可能性があります。詳細は、『SunVTS ユーザーマニュアル』を参照してください。

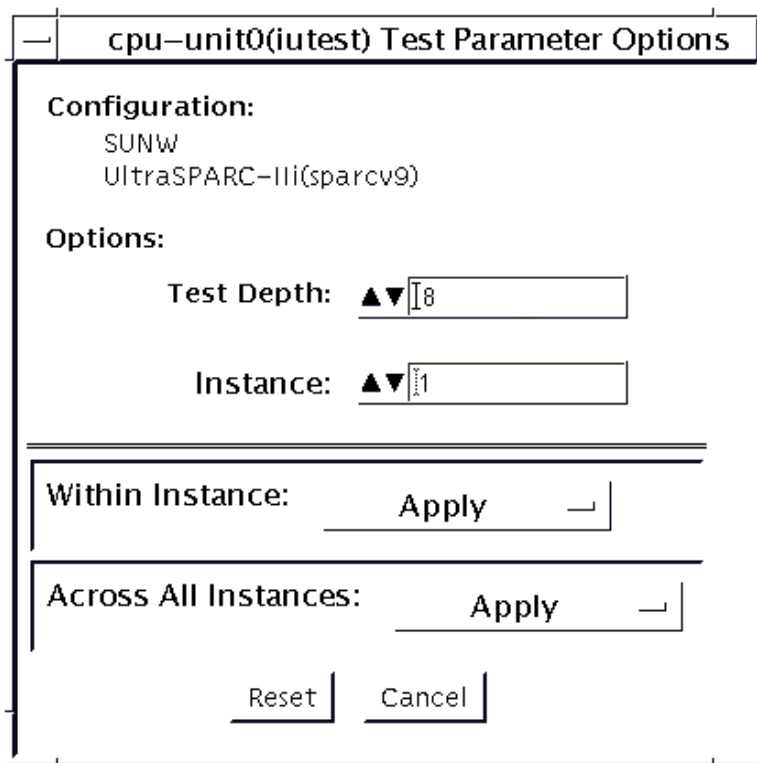


図 5-1 iutest のテストパラメタオプションダイアログボックス

iutest のテストパラメタオプションダイアログボックスのテストオプションで、唯一指定する必要があるオプションは Test Depth です。Test Depth は、すべてのレジスタウィンドウをテストする回数です。Test Depth のデフォルト値は 8、最大値は 64、最小値は 1 です。

itutest のテストモード

表 5-1 iutest がサポートしているテストモード

テストモード	説明
接続テスト	CPU の実装タイプ (たとえば、sparcv7、sparcv9 など)、動作周波数、および CPU の状態 (オンライン、オフラインなど) を表示します。
機能テスト (オフライン)	レジスタウィンドウをすべて確認し、障害が発生しているレジスタがある場合には該当するエラーメッセージを返します。レジストリに問題がない場合は、テストに成功したことを示すメッセージを表示します。

itutest のコマンド行構文

`/opt/SUNWvts/bin/iutest` 標準引数 `-o depth=値,dev=cpu-unitN`

itutest コマンド行構文では、**値**は Test_Depth パラメタオプションの値です (前述の iutest のオプションの節を参照してください)。**N**は CPU ユニット番号です (0、1、2 など)。この節で説明したもの以外のオプションを入力した場合には、テストでの動作は予測できないものになります。

注 - 64 ビットのテストは、sparcv9 サブディレクトリに格納されています (/opt/SUNWvts/bin/sparcv9/**テスト名**)。このディレクトリにテストが存在しない場合は、そのテストは、32 ビットのテストとしてだけ実行することができます。詳細は、『SunVTS 5.1 テストリファレンスマニュアル』(816-7254-10) の「32 ビットテストと 64 ビットテスト」を参照してください。

第6章

System Service Processor テスト (ssptest)

ssptest は、RSC (Remote System Control) 機能と ALOM (Advanced Lights-Out Management) 機能を検査します。RSC 機能は、Sun Enterprise 250 だけでなく、Sun Fire 280R 製品ラインとともに発売された次世代 RSC 2.0 プラグインカードにも組み込まれています。ALOM 機能は、Sun Fire V210 および Sun Fire V240 に組み込まれています。

RSC や ALOM を使用すると、システムの監視、ファームウェアの更新、および障害の回復において、遠隔アクセスを安全に行うことができます。RSC や ALOM では、内部シリアル回線 (2 つ)、I2C バス、リセット回線を使用してホストと通信します。

RSC 1.0 ハードウェアは、コントローラ、フラッシュ、SEEPROM、10 Mbps Ethernet ポート、および外部コンソール用シリアルポートで構成されます。

RSC 2.0 プラグインカードハードウェアは、コントローラ、フラッシュ、SEEPROM、10Mbps Ethernet ポート、FRUSEEPROM、ToD (Time of Day) デバイス、内部 PCMCIA モデムカード、およびバッテリーバックアップで構成されます。

ALOM ハードウェアは、Motorola MPC850 プロセッサ、フラッシュ、SEEPROM、10Mbps または 100Mbps Ethernet ポート、ToD (Time of Day) デバイス、シリアルトランシーバ、およびバッテリーバックアップで構成されます。

ssptest は、スケラブルテストではありません。

ssptest のサブテスト

ssptest では、テストするハードウェアのタイプ (RSC または ALOM) と、RSC ハードウェアのバージョン (1.0 または 2.0) によって、異なるサブテストとオプションが表示されます。

RSC 1.0、RSC 2.0、ALOM に共通のサブテストには、以下のものがあります。

表 6-1 RSC 1.0、RSC 2.0、ALOM で実行できるサブテスト

サブテスト	説明
Ethernet	ユーザーが指定したデータ、サイズ、パケット数を使用して、Ethernet デバイスで内部ループバックテストを実行します。 ユーザーが指定したデータ、サイズ、パケット数を使用して、外部ループバックテストを実行します。このテストを実行するには、RSC 1.0 では 10MB のハブまたはスイッチに、RSC 2.0 と ALOM では受動ループバックコネクタに接続する必要があります。 指定したホストに ping を送信し、応答を検査します。
Flash CRC	フラッシュデバイスで検査合計テストを実行します。
SEEPROM CRC	SEEPROM デバイスで検査合計テストを実行します。
Serial	ユーザーが指定したデータとサイズを使用して、2 つの内部シリアルポートで内部ループバックテストを実行します。 外部 ttyu ポートで、内部または外部テスト、もしくはその両方を実行します。外部テストでは受動ループバックコネクタが必要です。

ssptest を RSC 2.0 ハードウェアで実行する場合には、以下のサブテストも表示されます。

表 6-2 RSC 2.0 でのみ実行できるサブテスト

サブテスト	説明
FRU SEEPROM CRC	SEEPROM デバイスで検査合計テストを実行します。
I2C	ホストと RSC との間の I2C バス接続をテストします。
ToD	ToD デバイスに対して複数の読み取りを行い、読み取り時間が増加していることを確認します。
Modem	モデムが接続されていることを確認します。冗長モードで製造情報を表示します。AT 照会コマンドを実行します。

ssptest を ALOM ハードウェアで実行する場合には、以下のサブテストも表示されます。

表 6-3 ALOM でのみ実行できるサブテスト

サブテスト	説明
I2C	ホストと ALOM との間の I2C バス接続をテストします。
ToD	ToD デバイスに対して複数の読み取りを行い、読み取り時間が増加していることを確認します。

これらのサブテストは、RSC ファームウェアに含まれる固有のリアルタイムオペレーティングシステム (RTOS) で作成されたテスト `modlet` を呼び出します。ssptest のサブテストは、テスト `modlet` を実行し、パラメタを渡し、ホスト上のテストプロトコルを使用して結果を RSC または ALOM から RSC または ALOM の内部シリアル回線に取り出します。

ssptest のオプション

ダイアログボックスを表示するには、システムマップにあるテスト名を右クリックし、**Test Parameter Options** を選択します。システムマップにこのテスト名が表示されない場合は、グループツリーを展開すると表示される場合があります。展開しても表示されない場合は、このテストに合ったデバイスがシステムに含まれていない可能性があります。詳細は、『SunVTS ユーザーマニュアル』を参照してください。

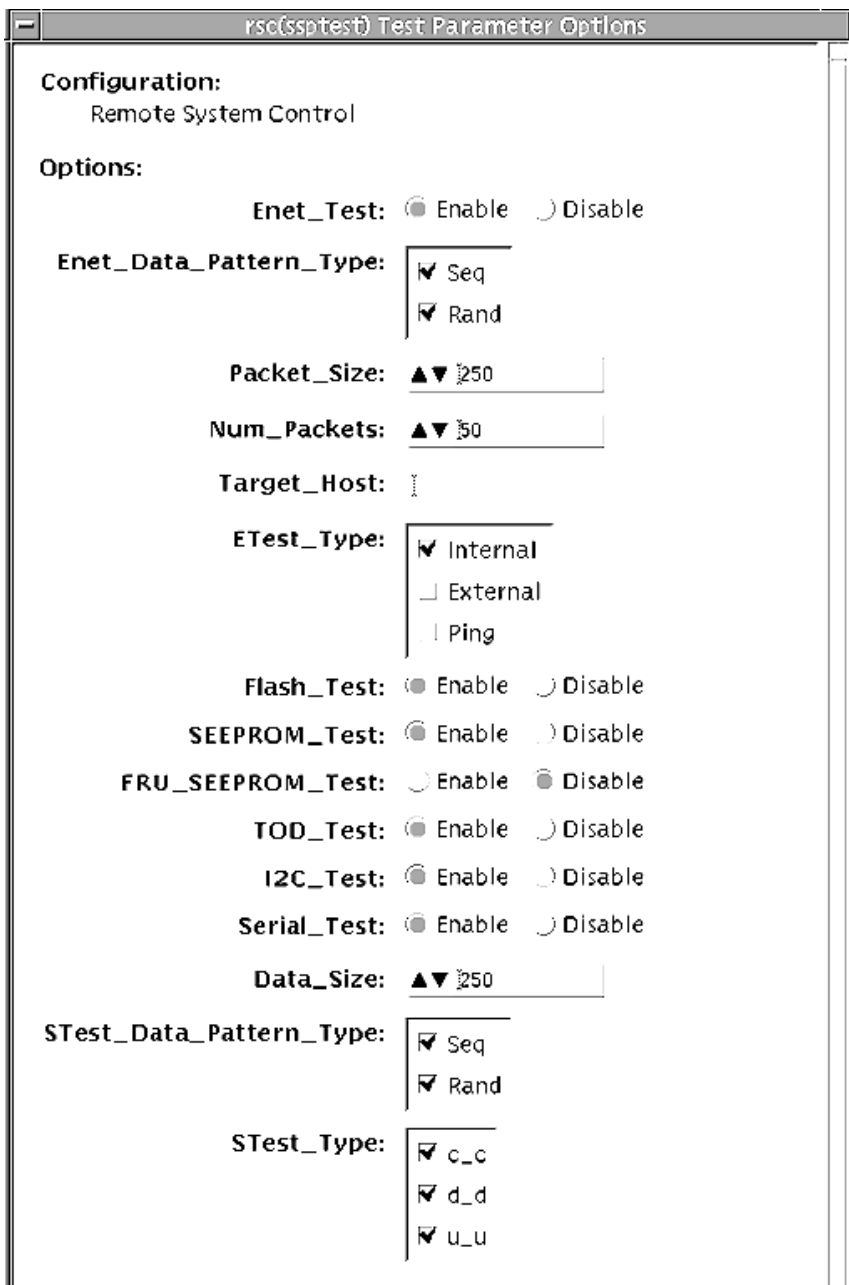


図 6-1 ssptest のテストパラメタオプションダイアログボックス (上部)

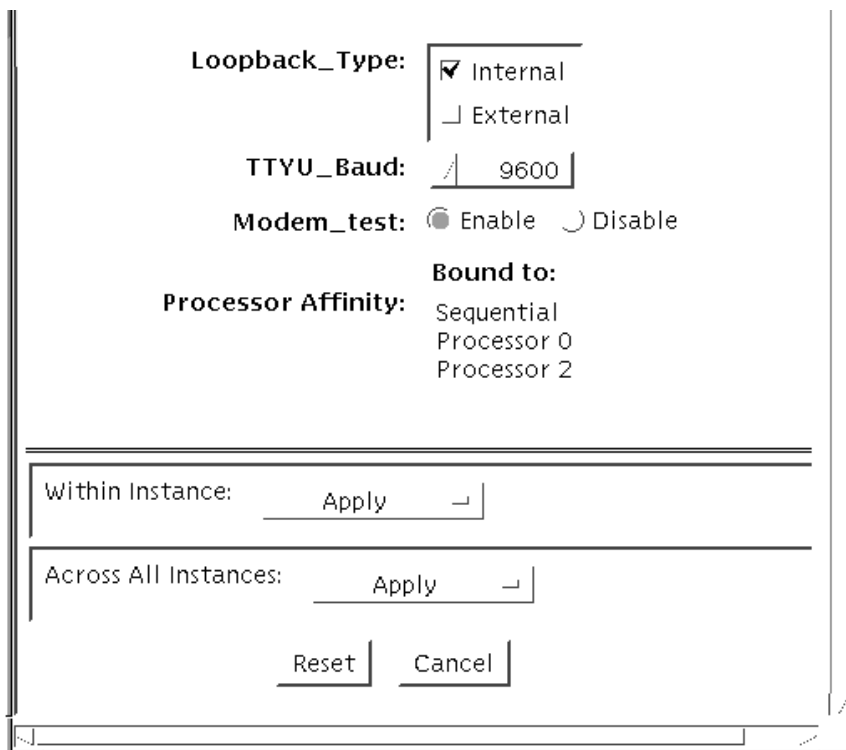


図 6-2 ssptest のテストパラメタオプションダイアログボックス (下部)

注 - ssptest のテストパラメタオプションダイアログボックスの **Configuration** フィールドには、テスト対象となっているハードウェアのタイプ (RSC または ALOM) が表示されます。RSC 1.0 と 2.0 の場合は、**Remote System Control** と表示されます。ALOM の場合は、**Advanced Lights-Out Management** と表示されます。

表 6-4 ssptest のオプション

ssptest のオプション	説明
Enet test	RSC または ALOM の Ethernet テストを有効または無効にします。
Data Pattern Type	テストに使用するデータパターンとして Sequential、Random、その両方のいずれかを選択します。
Packet Size	すべてのテストで送信するデータパケットのサイズを指定します。
Num Packets	1 つのテストループで送信するデータパケット数を指定します。

表 6-4 ssptest のオプション (続き)

ssptest のオプション	説明
Target Host	ping テストに使用するホストの IP アドレスを指定します。
Enet Test Type	内部、外部、または ping テストの一部、またはすべてを選択します。
Flash test	フラッシュ検査合計テストを有効または無効にします。
SEEPROM test	SEEPROM 検査合計テストを有効または無効にします。
FRU SEEPROM test	FRU SEEPROM 検査合計テストを有効または無効にします (RSC 2.0 のみ)。
TOD test	Time Of Day テストを有効または無効にします。
I2C test	I2C テストを有効または無効にします (RSC 2.0 と ALOM のみ)。
Serial test	RSC または ALOM のシリアルテストを有効または無効にします。
Data Size	送信するデータサイズを指定します。
Loopback Type	Internal、External、またはその両方を選択します。External には、ループバックコネクタが必要です。
Data Pattern Type	テストに使用するデータパターンとして Sequential、Random、その両方のいずれかを選択します。
Serial Test Type	テストするシリアルポートとして u to u、c to c、または d to d を選択します。
TTYU_Baud	ttyu ポートのテスト用に、固定ボーレートまたはすべてのボーレートを選択します。TTYU_Baud で有効なボーレートは、ALL、300、600、1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、57600、76800、115200 です。デフォルトは 9600 です。
Modem Test	RSC PCMCIA モデムテストを有効または無効にするために使用します (RSC 2.0 のみ)。

ssptest のテストモード

ssptestは、接続テストモードと機能テストモードをサポートしています。

表 6-5 ssptest がサポートしているテストモード

テストモード	説明
接続テスト	RSC または ALOM の状態を報告します。
機能テスト	RSC と ALOM の Ethernet、フラッシュ、EEPROM、ToD、I2C、シリアルデバイスをテストします。デフォルトでは、これらのすべてのテストで内部モードが使用されます。コンソールの出力先が RSC に変更されている場合、ssptest は ttyc に対してシリアルテストを行いません。ttyu に開いているログインがある場合、ttyu テストは実行されません。

ssptest のコマンド行構文

RSC 1.0: `/opt/SUNWvts/bin/ssptest` 標準引数 `-o enet=E/D, epatttype=seq+rand, esize=パケットサイズ, epkts=パケット数, target=IP アドレス, etest=I+E+P, flash=E/D, seeprom=E/D, serial=E/D, sdatsize=データサイズ, slb=I+E, spatttype=seq+rand, stest=u_u+c_c+d_d, ttyubaud=ボーレート |all`

RSC 2.0: `/opt/SUNWvts/bin/ssptest` 標準引数 `-o enet=E/D, epatttype=seq+rand, esize=パケットサイズ, epkts=パケット数, target=IP アドレス, etest=I+E+P, flash=E/D, seeprom=E/D, fruseeprom=E/D, tod=E/D, i2c=E/D, serial=E/D, sdatsize=データサイズ, slb=I+E, spatttype=seq+rand, stest=u_u+c_c+d_d, ttyubaud=ボーレート |all, rscmodem=E/D`

ALOM: /opt/SUNWvts/bin/ssptest 標準引数 -o enet=E/D,
 epatttype=seq+rand, esize=パケットサイズ, epkts=パケット数, target=IP アドレ
 ス, etest=I+E+P,
 flash=E/D, seeprom=E/D, tod=E/D, i2c=E/D, serial=E/D, sdatsize=データサイ
 ズ, slb=I, spattpye=seq+rand, stest=d_d

表 6-6 ssptest のコマンド行構文

引数	説明
enet =enable disable	RSC または ALOM の Ethernet テストを有効または無効にします。
epatttype =seq+rand	Enet テストに使用する既定のパターンオプション。
esize =パケットサイズ	Enet テストで使用するパケットのサイズ。
epkts =パケット数	Enet テストで送信するパケット数。
target =IP アドレス	Enet の ping テストの宛先システムの IP アドレス。
etest =Internal+External+Ping	内部、外部、または ping テストの一部、またはすべてを選択します。
flash =enable disable	RSC または ALOM のフラッシュ検査合計テストを有効または無効にします。
seeprom =enable disable	RSC または ALOM の SEEPROM 検査合計テストを有効または無効にします。
fruseeprom =E/D (RSC 2.0 のみ)	RSC の FRU SEEPROM 検査合計テストを有効または無効にします。
tod =E/D (RSC 2.0 と ALOM のみ)	RSC または ALOM の Time of Day テストを有効または無効にします。
i2c =E/D (RSC 2.0 と ALOM のみ)	RSC または ALOM の I2C テストを有効または無効にします。
serial =enable disable	RSC または ALOM の シリアルテストを有効または無効にします。
sdatsize =データサイズ	rsc または alom のシリアルテストのデータサイズ。
slb =Internal+External	ループバックタイプ。C と D ポートに対しては、External を選択することはできません。
spatttype =seq+rand	RSC または ALOM のシリアルテストに使用する既定のパターンオプション。

表 6-6 ssptest のコマンド行構文 (続き)

引数	説明
stest = <i>u_u+c_c+d_d</i>	RSC または ALOM のシリアルテストに使用するポート構成を指定します。
ttyu_baud = <i>ALL</i> 指定ボーレート	RSC のコンソールポートのテストに使用するボーレートを指定します。ttyu_baud で有効なボーレートは、ALL、300、600、1200、2400、4800、9600、14400、19200、38400、57600、76800、115200 です。デフォルトは 9600 です。
rscmodem = <i>E/D</i>	RSC の PCMCIA モデムテストを有効または無効にします。

注 - 64 ビットのテストは、sparcv9 サブディレクトリに格納されています (/opt/SUNWvts/bin/sparcv9/**テスト名**)。このディレクトリにテストが存在しない場合は、そのテストは、32 ビットのテストとしてだけ実行することができます。詳細は、『SunVTS 5.1 テストリファレンスマニュアル』(816-7254-10)の「32 ビットテストと 64 ビットテスト」を参照してください。

